DIMENSION MEASURING APPARATUS

Patent Number:

JP59061704

Publication date:

1984-04-09

Inventor(s):

NISHIKAWA KIHACHIROU; others: 01

Applicant(s)::

MATSUSHITA DENK SANGYO KK

Requested Patent:

□ JP59061704

Application Number: JP19820172738 19820930

Priority Number(s):

IPC Classification:

G01B11/02

EC Classification:

Equivalents:

JP1500863C, JP63052325B

Abstract

PURPOSE: To achieve an accurate measurement eliminating the need for considering the material condition of an object to be measured by providing a diffusion plate for diffusing light from a lamp, an optical system for forming an image of the diffusion plate at the position where thick surface to be measured of the object and the like.

CONSTITUTION:Light emitted by a lamp 1 is uniformized with a diffusion plate 2 to form a bright surface with an area. A condenser lens 3 is used to form an image of the diffusion plate 2 at P, the end face of an object 4 to be measured, namely, near the mesuring surface. At this point, the image formed on the surface P to be measured is made large sufficiently as compared with the section of the object to be measured so that not only a parallel light but also components of lights in the directions L1 and L2 radiate the object being measured. Thus, an image of the diffusion plate 2 ismade on the measuring surface P both upward and downward centered on the object 4 to be measured. This is formed with a light receiving lens 5 to measure the dimension of the thickness thereby enabling accurate measurement eliminating the need for considering material of the object to be measured.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(9 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-61704

⑤ Int. Cl.³G 01 B 11/02

識別記号

庁内整理番号 7428—2F ❸公開 昭和59年(1984)4月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

60寸法測定装置

@出

郊特 願 昭57-172738

願 昭57(1982)9月30日

仍発 明 者 西川喜八郎

横浜市港北区綱島東四丁目3番 1号松下通信工業株式会社内 @発 明 者 町田浩

横浜市港北区網島東四丁目3番 1号松下通信工業株式会社内

①出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

⑩代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

ryj #H 7

1、発明の名称

中次測定装置

2、特許請求の額明

ランプよりの光線を拡散させる拡散板と、被制 定物の側定内厚面が配像された位域に前配光拡散 板の像を形成する光学系と、前配像を受光する受 光レンズと、前配受光レンズの焦点におかれたテ レセントリック紋りとこのテレセントリック紋り を通過した光を検出するフォートタイオートアレ イを川いたラインセンサーカメラとからなる寸法 測定契慮。

3、発明の辞細な説明

産業上の利用分野

本発明は計測位限が多点ある板や管の内厚等の 一点を揃え、フォトダイオードナレイを使用した ラインセンサーカメラで内厚等測定をする寸法測 定契機を提供するものである。

従来例の構成とその問題点

従来の内厚寸法測定方法は接触式のマイクロメ

ータやダイアルゲージを用いていたが接触式のため被測定物がゴムのように柔軟性がある場合、正確な寸法を測定することができなかった。また表面が柔かい金属の被測定物では測定中にキメ等をつける恐れがあった。

発明の目的

本発明は上記の欠点を除去し、被制定物の材質 状態を考慮する必要が無く、 非接触により内厚等 を正確に測定する装備を提供することを目的とす

発明の構成

本発明は上記の目的を達成するためにラインセンサーカメラとテレセントリック較りと測定而近 傍に光を結像させる光学系によって寸法測定をし ようとするものである。

実施例の説明

以下水発明の実施例を第1図、第2図に基づいて脱明する。同図において1はランプ、2は均一な拡散面をつくる拡散板、3は寒光レンズであり、拡散板2の拡散面の光を測定面Pに投光させるも

のである。4は板状、管状等の被測定物、5は測定而Pの像を受ける受光レンズ、6はテレセントリック絞りであり、受光レンズ5に入る光の平行成分のみを抽出するためのものである。7はラインセンサーカメラのフォトダイオードアレイであり、寸法計測部分である。

でに上記埃施例の動作を説明する。ランプ1の 発した光は拡散板2により均一化され、ある面積 をもった確度而になる。これを集光レンズ3により被測定物4の濫而であるP、即ち測定面上にで 拡散板2の像をつくる。この時、測定面Pにできる。とのより被測定物を下が大きな像をつかくない。 る像は、被測定物所面より十分大きな像をしい。 し2方向の光の成分が服射される。よって拡大をでより被測ですれる。よってが近れる。よってが変し、面になってがで とには物形できる。これを受光レンズ5に対し、面 との像ができる。これを受光レンズ5になってはなってよった。すなわち暗にといるがでしたすで を測定する。すなわち暗にその他は明細になり暗れの部分をカウントすることによりす法を

発明の効果

以上のように本発明によれば、被測定物を選択せず、レンズ倍率の変化もなく簡単な位置決めのみで正確に肉厚等の寸法を非接触で測定できる。 またこのため、被測定物に傷をつける等の惧れも

ない。

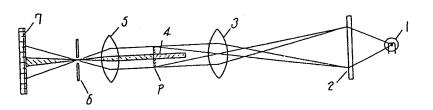
4、関面の簡単な説明

第1 図は不発明の一実施例における寸法測定装 置の構成図、第2 図は同要部拡大構成図、第3 図 (11、回は測定寸法部分の側面図である。

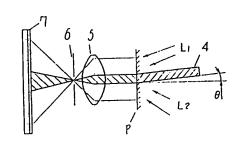
1 …… ランプ、2 ……拡散板、3 ……集光レンズ、4 …… 被測定物、5 …… 受光レンズ、6 ……
テレセントリック絞り、7 ……フォトダイオード
アレイ。

代門人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

寒 1 図

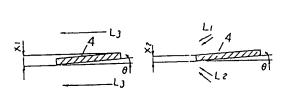


aa 2 ⊠



新 3 図

a)



(D)